**Селезнев, Игорь Львович. Разработка методов и средств оценки устойчивости микропроцессоров в составе РЭС при воздействии электромагнитных помех : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.27.01; 05.13.05 / Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники.- Минск, 1994.- 23 с.: ил. РГБ ОД, 9 94-2/2025-1**